

Störfestigkeit von Geräten

Kurzbeschreibung

Die Integrationsdichte von Integrierten Schaltkreisen (IC) sowie deren interne Verarbeitungsgeschwindigkeit steigen immer weiter. Schnelle Störimpulse, die in der Vergangenheit von den langsameren ICs noch nicht wahrgenommen wurden, können nun zu gravierenden Beeinträchtigungen führen. Pin-granulare Störfestigkeitsuntersuchungen an ICs zeigen Wege auf, wie zukünftig sogar robustere ICs hergestellt werden können.